

ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА

УДК 548.732: 539.2

ДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ РЕЗОНАНСНОЙ ДИФРАКЦИИ
РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ГЕОМЕТРИИ БРЭГГА
В СОВЕРШЕННЫХ КРИСТАЛЛАХ

А. П. Орешко

(кафедра физики твердого тела)

Проведено точное решение задачи зеркального и дифракционного отражения рентгеновского излучения в условиях резонансной дифракции от идеального кристалла в геометрии Брэгга. Показана возможность эффекта аномального прохождения сквозь кристалл излучения с энергией, близкой к энергии K -края поглощения атомов.

Введение

Резонансная дифракция (РД) рентгеновского излучения (РИ) наблюдается при энергии падающего излучения, близкой к краю поглощения какого-либо элемента, входящего в состав кристалла, и является интенсивно развивающимся методом изучения свойств кристаллов [1, 2]. Более доступным методом РД стал при появлении источников синхротронного излучения, сочетающих большую яркость и высокую степень поляризации излучения с возможностью выбора нужной длины волны.

Так как вблизи краев поглощения величина коэффициента поглощения резко увеличивается и тем самым уменьшается глубина проникновения излучения в вещество, для интерпретации полученных экспериментальных данных по РД используется кинематическое приближение теории дифракции [3]. Однако ряд наблюдаемых в последнее время явлений не может быть удовлетворительно описан в рамках кинематической теории дифракции, что вызвало необходимость развития динамической теории РД.

Впервые попытка описания динамического рассеяния РИ в условиях РД предпринята в [4], где использовался подход, аналогичный методу Дарвина [5] для описания динамического рассеяния РИ, основанный на введении амплитуды рассеяния РИ резонансным атомом и рассмотрении процессов многократного рассеяния.

В настоящей работе развивается динамическая теория резонансной дифракции рентгеновского излучения в форме, основанной на решении уравнений Максвелла в среде с периодически меняющейся поляризуемостью [6].

1. Динамическая теория резонансной
дифракции

Из микроскопических уравнений Максвелла в приближении линейной связи между индукцией

$\mathbf{D}(\mathbf{r}, t)$ и напряженностью $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t)$ электрического поля в стационарной пространственно-однородной среде можно получить систему уравнений для Фурье-амплитуд поля в совершенном кристалле с учетом анизотропии, пространственной и временной дисперсии [7]:

$$\left[1 - \frac{(\mathbf{k}, \mathbf{k})}{\kappa_0^2} + \bar{\chi}^0(\omega, \mathbf{k}) \right] \mathbf{E}(\omega, \mathbf{k}) + \frac{1}{\kappa_0^2} ((\mathbf{E}(\omega, \mathbf{k}), \mathbf{k}), \mathbf{k}) + \sum_{\mathbf{h} \neq 0} \bar{\chi}^{\mathbf{h}}(\omega, \mathbf{k}) \mathbf{E}(\omega, \mathbf{k} + \mathbf{h}) = 0, \quad (1)$$

где $\mathbf{E}(\omega, \mathbf{k})$ — Фурье-компоненты напряженности электрического поля в кристалле, κ_0 — величина волнового вектора в вакууме. Величина $\chi_{ij}(\omega, \mathbf{k})$ называется диэлектрической поляризуемостью (ДП) среды, общие соотношения симметрии для тензора ДП рассмотрены в [3, 8]. Второй член выражения (1) учитывает непоперечность поля.

Решение уравнений (1) с привлечением граничных условий и является основной задачей динамической теории дифракции РИ.

В традиционной рентгеновской кристаллооптике расчет поляризуемости проводится обычно в приближении сильной связи [8], в котором не учитываются явления анизотропии и пространственной дисперсии, т. е. поляризуемости χ_{ij} считаются скалярами, а поля — поперечными. Однако вблизи краев поглощения явлением анизотропии пренебрегать нельзя.

Рассмотрим двухволновую дифракцию полей $\mathbf{E}_0 = \mathbf{E}(\omega, \mathbf{q}_0)$ и $\mathbf{E}_h = \mathbf{E}(\omega, \mathbf{q}_h)$, где \mathbf{q}_0 и $\mathbf{q}_h = \mathbf{q}_0 + \mathbf{h}$ — волновые векторы проходящей и дифрагированной волн в кристалле, и пренебрежем эффектами пространственной дисперсии, т. е. поля будем считать поперечными. Тогда для скалярных амплитуд $\mathbf{E}_{0,h}^{(j)}$ проходящей $\mathbf{E}_0 = \mathbf{e}_0^{(j)} E_0^{(j)}$ и дифрагированной $\mathbf{E}_h = \mathbf{e}_h^{(j)} E_h^{(j)}$ волн следуют уравнения,

описывающие динамическую дифракцию первичного излучения:

$$\delta_0 \mathbf{e}_0^j E_0^{(j)} - \tilde{\chi}^0 \mathbf{e}_0^j E_0^{(j)} - \tilde{\chi}^{-h} \mathbf{e}_h^j E_h^{(j)} = 0, \quad (2)$$

$$\delta_h \mathbf{e}_h^j E_h^{(j)} - \tilde{\chi}^0 \mathbf{e}_h^j E_h^{(j)} - \tilde{\chi}^h \mathbf{e}_0^j E_0^{(j)} = 0, \quad (3)$$

где $\mathbf{e}_{0,h}^j$ ($j = 1, 2$) — единичные векторы σ - и π -поляризации проходящего и дифрагированного излучения ($\mathbf{e}_0^1 = \mathbf{e}_h^1$), $\mathbf{e}_{0,h}^3$ — единичные векторы вдоль волновых векторов $\mathbf{q}_{0,h}$ соответственно, а $\delta_{0,h} = [(\mathbf{q}_{0,h}, \mathbf{q}_{0,h})/\kappa_0^2] - 1$. В (2), (3) проводится суммирование по повторяющимся индексам $j = 1, 2, 3$. Схематичное пространственное расположение векторов $\mathbf{e}_{0,h}^j$ и $\mathbf{q}_{0,h}$ приведено на рис. 1. Из условия поперечности полей следует, что $E_{0,h}^{(3)} = 0$.

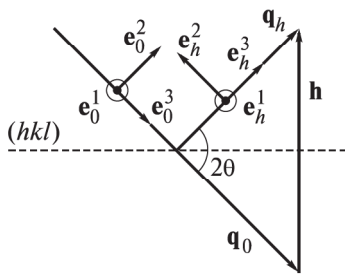


Рис. 1. Схема расположения единичных векторов $\mathbf{e}_{0,h}^j$, волновых векторов проходящего \mathbf{q}_0 и дифрагированного \mathbf{q}_h излучения и вектора обратной решетки \mathbf{h} . (hkl) — отражающая плоскость

Домножив выражения (2), (3) слева на \mathbf{e}_0^i и \mathbf{e}_h^i ($i = 1, 2$) и введя обозначения $C^{(i)} = (\mathbf{e}_0^i, \mathbf{e}_h^i) = \{1 (i = 1); \cos 2\theta (i = 2)\}$, $C^{(3)} = \sin 2\theta$, где θ — угол между падающим излучением и отражающими плоскостями (hkl) , получим следующую основную систему уравнений динамической теории РД:

$$\begin{aligned} & (\delta_0 - \chi_{11}^0) E_0^{(1)} - C^{(1)} \chi_{11}^{-h} E_h^{(1)} - \chi_{12}^0 E_0^{(2)} - \\ & - (C^{(2)} \chi_{12}^{-h} - C^{(3)} \chi_{13}^{-h}) E_h^{(2)} = 0, \\ & - C^{(1)} \chi_{11}^h E_0^{(1)} + (\delta_h - \chi_{11}^0) E_h^{(1)} - \chi_{12}^0 E_0^{(2)} - \\ & - (C^{(2)} \chi_{12}^0 - C^{(3)} \chi_{13}^0) E_h^{(2)} = 0, \\ & - \chi_{21}^0 E_0^{(1)} - \chi_{21}^{-h} E_h^{(1)} + (\delta_0 - \chi_{22}^0) E_0^{(2)} - \\ & - (C^{(2)} \chi_{22}^{-h} - C^{(3)} \chi_{23}^{-h}) E_h^{(2)} = 0, \\ & - (C^{(2)} \chi_{21}^h - C^{(3)} \chi_{31}^h) E_0^{(1)} - (C^{(2)} \chi_{21}^0 - C^{(3)} \chi_{31}^0) E_h^{(1)} - \\ & - (C^{(2)} \chi_{22}^h - C^{(3)} \chi_{32}^h) E_0^{(2)} + \\ & + \{(\delta_h - [\chi_{22}^0 C^{(2)2} - \chi_{33}^0 C^{(3)2}]) + \\ & + C^{(2)} C^{(3)} (\chi_{23}^0 - \chi_{32}^0)\} E_h^{(2)} = 0. \end{aligned} \quad (4)$$

Отличие системы уравнений (4) от хорошо известной основной системы динамической теории состоит в наличии недиагональных элементов тензора ДП χ . Если предположить, что χ — скалярная

величина, то система (4) совпадает с традиционной основной системой динамической теории [6].

Система основных уравнений имеет нетривиальное решение только в случае равенства нулю детерминанта этой системы:

$$\det A = 0, \quad (5)$$

где A — матрица коэффициентов (4). Дисперсионное уравнение (5) позволяет с привлечением граничных условий для волновых векторов на границе раздела двух сред найти величины волновых векторов $\mathbf{q}_{0,h}$ в кристалле.

В немагнитных кристаллах тензор ДП имеет вид $\chi_{ij} = (\chi_0 + \chi'_0 + i\chi''_0)\delta_{ij} + \chi'_{ij}$, χ_0 вызван потенциальным вкладом в диэлектрические свойства кристалла; χ'_0 , χ''_0 — добавки, включающие в себя изотропную часть эффектов дисперсии и поглощения; а χ'_{ij} вызван анизотропным резонансным вкладом [1, 8, 9]:

$$\begin{aligned} \chi'_{jm} = & \chi_{jm}^{\text{dd}} + i\chi_{jmn}^{\text{dqs}}(k'_n - k_n) + i\chi_{jmn}^{\text{dqa}}(k'_n + k_n) + \\ & + \chi_{jnmp}^{\text{qq}} k'_n k_p + \dots, \end{aligned} \quad (6)$$

где \mathbf{k} и \mathbf{k}' — волновые векторы соответственно падающей и рассеянной волн; χ_{jm}^{dd} , χ_{jmn}^{dq} и χ_{jnmp}^{qq} — диполь-дипольный (ДД), диполь-квадрупольный (ДК) и квадруполь-квадрупольный вклады в резонансную часть ДП, а верхние индексы «s» и «a» отвечают симметричной и антисимметричной частям ДК-вклада.

Последовательное описание тензора ДП строится на основе квантово-механической теории, требует знания атомных и кристаллических волновых функций электронов [8–10] и выходит за рамки настоящей работы. Необходимо отметить, что компоненты тензора ДП вычисляются предварительно (вычисление тензора χ_{ij} можно провести, например, при помощи программы FDMNES [11]) и затем считаются постоянным в расчетах по динамической теории дифракции.

Перейдем к анализу дисперсионного уравнения (5). В силу непрерывности тангенциальных (вдоль поверхности) составляющих волновых векторов падающей на кристалл волны \mathbf{k}_0 и проходящей волны в среде \mathbf{q}_0 , вектор \mathbf{q}_0 получает приращение только вдоль нормали к поверхности \mathbf{n} (направленной в глубь среды) т.е. $\mathbf{q}_0 = \mathbf{k}_0 + k_0 \varepsilon \mathbf{n}$, где ε — так называемая аккомодация [6], подлежащая дальнейшему определению.

Таким образом, подставив тензор ДП в виде (6) в (5), получим, что дисперсионное уравнение является уравнением восьмой степени относительно величины аккомодации ε и внутри кристалла может распространяться 8 проходящих и 8 дифрагированных волн. При этом в случае толстого кристалла следует выбирать только такие решения, для которых $\text{Im } \varepsilon_j > 0$.

2. Геометрия Брэгга

Рассмотрим задачу о зеркальном и дифракционном отражении плоской монохроматической волны $\mathbf{E}_0 \exp(i\mathbf{k}_0\mathbf{r})$ от идеального монокристалла в условиях РД. Решение задачи будем проводить в наиболее общем случае скользящей некопланарной брэгговской дифракции [12, 13].

Излучение падает из вакуума под произвольным углом скольжения φ_0 по отношению к поверхности так, что одновременно имеет место дифракционное отражение от атомно-кристаллических плоскостей, составляющих угол ψ по отношению к нормали \mathbf{n} , направленной в глубь кристалла вдоль оси z .

Поле в вакууме над поверхностью кристалла ($z \leq 0$) состоит из трех волн:

$$\mathbf{E}_{\text{vac}}(\mathbf{r}) = A_0 \exp(i\mathbf{k}_0\mathbf{r}) + A_S \exp(i\mathbf{k}_S\mathbf{r}) + A_h \exp(i\mathbf{k}_h\mathbf{r}), \quad (7)$$

где A_0 , A_S и A_h — амплитуды падающей, зеркально отраженной и дифрагированной волн соответственно, $|\mathbf{k}_0| = |\mathbf{k}_S| = |\mathbf{k}_h| = k_0$, $k_0 = 2\pi/\lambda$, $k_{Sz} = -k_{0z}$. Рентгеновская волна возбуждает в кристалле когерентную суперпозицию проходящей и дифрагированной волн

$$\mathbf{E}_{\text{cr}}(\mathbf{r}) = E_0 \exp(i\mathbf{q}_0\mathbf{r}) + E_h \exp(i\mathbf{q}_h\mathbf{r}), \quad (8)$$

где $E_{0,h}$ — амплитуды, $\mathbf{q}_{0,h}$ — волновые векторы проходящей и дифрагированной волн в кристалле. Амплитуды E_0, E_h в (8) удовлетворяют системе динамических уравнений (4), а величина ε определяется из уравнения (5).

Анализ корней дисперсионного уравнения показывает, что в геометрии Брэгга только 4 корня ε_j удовлетворяют условию $\text{Im} \varepsilon_j > 0$, и в кристалле могут распространяться 4 проходящих и 4 дифрагированных волны.

Для определения амплитуд полей в (7), (8) нужно записать условия непрерывности тангенциальных компонент электрических и магнитных полей на границе кристалл–вакуум. В итоге получим систему уравнений

$$A_0^\sigma + A_S^\sigma = \sum_{j=1}^4 E_{0j}^\sigma, \quad \gamma_0 (A_0^\sigma - A_S^\sigma) = \sum_{j=1}^4 \Gamma_{0j} E_{0j}^\sigma, \\ A_h^\sigma = \sum_{j=1}^4 R_{hj}^\sigma E_{0j}^\sigma, \quad -\gamma_h A_h^\sigma = \sum_{j=1}^4 \Gamma_{hj} R_{hj}^\sigma E_{0j}^\sigma, \quad (9)$$

$$A_0^\pi + A_S^\pi = \sum_{j=1}^4 R_{0j}^{\sigma\pi} E_{0j}^\sigma, \quad \gamma_0 (A_0^\pi - A_S^\pi) = \sum_{j=1}^4 \Gamma_{0j} R_{0j}^{\sigma\pi} E_{0j}^\sigma, \\ A_h^\pi = \sum_{j=1}^4 R_{hj}^\pi R_{0j}^{\sigma\pi} E_{0j}^\sigma, \quad -\gamma_h A_h^\pi = \sum_{j=1}^4 \Gamma_{hj} R_{hj}^\pi R_{0j}^{\sigma\pi} E_{0j}^\sigma, \quad (10)$$

где верхний индекс σ отвечает σ -компоненте, а π — π -компоненте, $\gamma_0 = k_{0z}/k_0$, $\gamma_h = (\mathbf{k}_0 + \mathbf{h})_z/k_0$. Если φ_0 — скользящий угол падения излучения

на кристалл, то $\gamma_0 = \sin \varphi_0$, $\gamma_h = \gamma_0 - \psi_B$, где $\psi_B = 2 \sin \psi \sin \theta_B$ — эффективный параметр угла наклона отражающих плоскостей ($\psi > 0$, $h_z < 0$), а θ_B — угол Брэгга, который определяется из соотношения $h = 2k_0 \sin \theta_B$.

Пусть φ_h — угол выхода дифрагированного излучения в вакуум по отношению к поверхности, тогда z -проекция $k_{hz} = -k_0 \gamma_h$, где $\gamma_h = \sin \varphi_h$ ($\varphi_h > 0$). Дифракционное отражение в область $z < 0$ (геометрия Брэгга) реализуется при таких углах скольжения φ_0 , что $\gamma_0 < \psi_B$, т.е. $\gamma_{h0} < 0$. Угол выхода φ_h при заданных углах φ_0 и ψ определяется выражением [12] $\gamma_h = (\gamma_{h0}^2 + \alpha)^{1/2}$, где параметр $\alpha = 1 - (\mathbf{k}_0 + \mathbf{h})^2/k_0^2 = 2\Delta\theta \sin 2\theta_B$ характеризует угловую отстройку падающего излучения от угла Брэгга, а условие $\alpha > -\gamma_{h0}^2$ задает допустимые отклонения $\Delta\theta = \theta - \theta_B$ от точного угла Брэгга.

В (9), (10) введены обозначения $\Gamma_{0j} = \gamma_0 + \varepsilon_j$, $\Gamma_{hj} = \gamma_h + \varepsilon_j$ ($j = 1-4$) и учтены связи между амплитудами дифрагированных и проходящих волн в кристалле: $E_{hj}^\sigma = R_{hj}^\sigma E_{0j}^\sigma$, $E_{hj}^\pi = R_{hj}^\pi E_{0j}^\pi$, $E_{0j}^\pi = R_{0j}^{\sigma\pi} E_{0j}^\sigma$, следующие из (4).

Решение системы (9), (10) для амплитуд зеркально отраженных и дифрагированных волн имеет вид

$$A_S^\sigma = \frac{1}{2\gamma_0} \sum_{j=1}^4 (\gamma_0 - \Gamma_{0j}) (T_j^\sigma A_0^\sigma + T_j^\pi A_0^\pi), \quad (11)$$

$$A_S^\pi = \frac{1}{2\gamma_0} \sum_{j=1}^4 (\gamma_0 - \Gamma_{0j}) R_{0j}^{\sigma\pi} (T_j^\sigma A_0^\sigma + T_j^\pi A_0^\pi), \quad (12)$$

$$A_h^\sigma = \sum_{j=1}^4 R_{hj}^\sigma (T_j^\sigma A_0^\sigma + T_j^\pi A_0^\pi), \quad (13)$$

$$A_h^\pi = \sum_{j=1}^4 R_{hj}^\pi R_{0j}^{\sigma\pi} (T_j^\sigma A_0^\sigma + T_j^\pi A_0^\pi), \quad (14)$$

где введены следующие обозначения:

$$T_1 = G_{41}G_{52} - G_{51}G_{42}, \quad T_1^\sigma = -2\gamma_0 G_{42}/T_1, \\ T_1^\pi = 2\gamma_0 G_{52}/T_1, \quad T_2^\sigma = 2\gamma_0 G_{41}/T_1, \quad T_2^\pi = -2\gamma_0 G_{51}/T_1, \\ G_{1j} = \{R_{hj}^\sigma(\gamma_h + \Gamma_{hj})\}/\{R_{h4}^\sigma(\gamma_h + \Gamma_{h4})\}, \\ G_{2j} = \{R_{hj}^\sigma R_{0j}^{\sigma\pi}(\gamma_h + \Gamma_{hj})\}/\{R_{h4}^\sigma R_{0j}^{\sigma\pi}(\gamma_h + \Gamma_{h4})\}, \\ G_{3j} = (G_{2j} - G_{1j})/(G_{23} - G_{13}), \\ G_{4j} = R_{0j}^{\sigma\pi}(\gamma_0 + \Gamma_{0j}) - R_{03}^{\sigma\pi}(\gamma_0 + \Gamma_{03})G_{3j} - \\ - R_{04}^{\sigma\pi}(\gamma_0 + \Gamma_{04})\{G_{1j} - G_{13}G_{3j}\}, \\ G_{5j} = (\gamma_0 + \Gamma_{0j}) - (\gamma_0 + \Gamma_{03})G_{3j} - \\ - (\gamma_0 + \Gamma_{04})\{G_{1j} - G_{13}G_{3j}\}.$$

Соотношения (11)–(14) представляют собой точное решение задачи зеркального и дифракционного отражения РИ от идеального кристалла в геометрии Брэгга. Они справедливы для любых углов

φ_0 при $\gamma_0 \leq \psi_B$ и любых допустимых отклонений $\alpha \geq -(\gamma_0 - \psi_B)^2$ от точного угла Брэгга и, как легко показать, в случае диагонального тензора ДП сводятся к полученным ранее соотношениям в нерезонансной теории [13].

3. Аномальное прохождение

Рассмотрим частный случай дифракционного отражения от совершенного монокристалла, обладающего кристаллической решеткой с кубической симметрией. В этом случае тензор ДП диагональный, а система уравнений (4) однородна относительно состояний поляризации. Для упрощения задачи учтем только главный ДД-вклад в резонансную часть ДП (6).

Таким образом, фурье-компоненты тензора ДП примут вид $\tilde{\chi}^{0,\pm h} = \chi^{0,\pm h} \delta_{ij} + \chi_{ii}^{0,\pm h} \delta_{ij}$ ($i, j = 1, 2, 3$), где опущены верхние индексы «dd» у элементов χ_{ii} , а система уравнений динамической теории РД (4) — вид

$$\begin{aligned} (\delta_0 - \chi^0)E_0^{(1)} - \chi_{11}^0 E_0^{(1)} - \chi^{-h} E_h^{(1)} - \chi_{11}^{-h} E_h^{(1)} &= 0, \\ -\chi^h E_0^{(1)} - \chi_{11}^h E_0^{(1)} + (\delta_h - \chi^0)E_h^{(1)} - \chi_{11}^0 E_h^{(1)} &= 0, \\ (\delta_0 - \chi^0)E_0^{(2)} - \chi_{22}^0 E_0^{(2)} - C^{(2)} \chi^{-h} E_h^{(2)} - \\ - C^{(2)} \chi_{22}^{-h} E_h^{(2)} &= 0, \\ C^{(2)} \chi^h E_0^{(2)} - C^{(2)} \chi_{22}^h E_0^{(2)} + (\delta_h - \chi^0)E_h^{(2)} - \\ - (\chi_{22}^0 C^{(2)2} - \chi_{33}^0 C^{(3)2})E_h^{(2)} &= 0. \end{aligned} \quad (15)$$

Пренебрегая квадратичными по величине ε членами (не рассматриваем скользящие схемы дифракции) для корней ε_i первого и второго уравнений (15), получим

$$\begin{aligned} \varepsilon_{1,2} &= [\{\eta^0(\gamma_0 + \gamma_{h0}) + \gamma_0 \alpha\} \pm \\ &\pm \{[\eta^0(\gamma_0 - \gamma_{h0}) + \gamma_0 \alpha]^2 + 4\gamma_0 \gamma_{h0} \eta^h \eta^{-h}\}^{1/2}] / 4\gamma_0 \gamma_{h0}, \end{aligned} \quad (16)$$

где $\eta^{0,\pm h} = \chi^{0,\pm h} + \chi_{11}^{0,\pm h}$. Видно, что если параметр

$$\Delta = \eta^0 \eta^0 - \eta^h \eta^{-h} = 0, \quad (17)$$

то при точном выполнении условия Брэгга ($\alpha = 0$) корень ε_2 обращается в нуль и одна из волн будет распространяться без поглощения. Ситуации, в которых для одного из корней $\text{Im} \varepsilon_j = 0$, будем называть случаями аномального прохождения. Ранее в [14] исследовался эффект аномального прохождения γ -квантов, резонансно взаимодействующих с ядрами в кристалле.

Возникает вопрос, возможна ли ситуация, при которой параметр Δ (17) обращается в нуль или хотя бы достигает своего минимального значения. В качестве примера на рис. 2 приведены расчетные энергетические зависимости действительной и мнимой частей параметра Δ для отражения Ge(224) вблизи K -края поглощения германия. Вычисления проводились при помощи программы FDMNES [11] для кластера Ge, состоящего из 100 атомов [15].

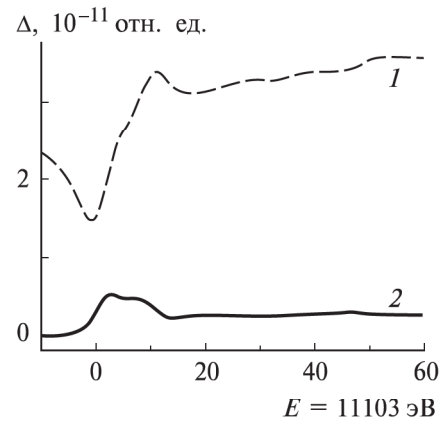


Рис. 2. Энергетическая зависимость действительной (1) и мнимой (2) части параметра Δ (17) для «запрещенного» отражения (224) вблизи K -края поглощения Ge ($E_K = 11\,103$ эВ)

Видно, что при энергии падающего излучения, примерно на 1 эВ меньшей энергии K -края поглощения, параметр Δ принимает свое минимальное значение. Таким образом, действительно можно говорить о том, что на левом краю K -края поглощения Ge возможно наблюдение эффекта аномального прохождения.

Амплитудный коэффициент дифракционного отражения в рассматриваемом случае определяется выражением $R_{1,2} = (2\gamma_0 \varepsilon - \eta^0) / \eta^{-h}$, и кривая дифракционного отражения (КДО) в РД, так же как и в нерезонансной, имеет вид пика с практически плоской вершиной в области углов $\Delta\theta_0 - \Delta\theta_B \leq \Delta\theta \leq \Delta\theta_0 + \Delta\theta_B$, где выражение под знаком квадратного корня в (16) отрицательно:

$$\begin{aligned} \Delta\theta_0 &= -\text{Re}(\chi^0)(1+b)/2b \sin 2\theta_B - \\ &- \text{Re}(\chi_{11}^0)(1+b)/2b \sin 2\theta_B \end{aligned} \quad (18)$$

— смещение брэгговского максимума от угла θ_B в результате преломления РИ, а $\Delta\theta_B = \text{Re}(\{\eta^h \eta^{-h}\}^{1/2}) / b^{1/2} \sin 2\theta_B$ — полуширина КДО на половине высоты. Второе слагаемое в выражении (18) описывает дополнительное смещение брэгговского максимума за счет эффектов РД.

Таким образом, в настоящей работе построена динамическая теория резонансной дифракции рентгеновского излучения в совершенных кристаллах. Показано, что основные уравнения динамической теории дифракции являются частным случаем резонансной динамической теории. Показана возможность явления аномального прохождения сквозь кристалл излучения с энергией, близкой к энергии краев поглощения атомов.

Автор выражает глубокую благодарность М. А. Андреевой, В. А. Бушуеву и Е. Н. Овчинниковой за интерес к работе и плодотворные обсуждения

полученных результатов. Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 04-02-16866 и 05-02-16770).

Литература

1. Дмитриенко В.Е., Овчинникова Е.Н. // Кристаллография. 2003. **48**, № 6. С. 59.
2. Hodeau J.L., Favre-Nicolin V., Bos S. et al. // Chem. Rev. 2001. **101**. P. 1843.
3. Беляков В.А., Дмитриенко В.Е. // УФН. 1989. **158**, № 4. С. 679.
4. Ведринский Р.В., Козырев В.Э., Новакович А.А., Гончар А.А. // Исследовано в России. 2005. **129**. С. 1311 (<http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2005/129.pdf>).
5. Darwin C.G. // Phil. Mag. 1917. **19**. P. 315, 675.
6. Пинскер З.Г. Рентгеновская кристаллооптика. М., 1982.
7. Агранович В.М., Гинзбург В.Л. Кристаллооптика с учетом пространственной дисперсии и теория экситонов. М., 1979.
8. Колпаков А.В., Бушуев В.А., Кузьмин Р.Н. // УФН. 1978. **126**, № 3. С. 479.
9. Vlame M. Resonant anomalous X-Ray scattering / Eds. G. Materlik, C.J. Sparks, K. Fisher. Amsterdam, 1994. P. 495.
10. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. М., 1992.
11. http://www-cristallo.polycnrs-gre.fr/Themes_de_recherche/Simul/.
12. Александров П.А., Афанасьев А.М., Степанов С.А. // Кристаллография. 1984. **29**, № 2. С. 197.
13. Бушуев В.А., Орешко А.П. // ФТТ. 2001. **43**, № 5. С. 906.
14. Афанасьев А.М., Каган Ю. // ЖЭТФ. 1973. **64**, № 3. С. 1558.
15. Орешко А.П., Дмитриенко В.Е., Жоли Ив и др. // Изв. РАН. Сер. физ. 2004. **68**, № 4. С. 578.

Поступила в редакцию
15.05.06